



Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Optyczne techniki pomiarowe, PG_00048097						
Kierunek studiów	Elektronika i telekomunikacja						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu			2027/2028		
Poziom kształcenia	I stopnia - inżynierskie	Grupa zajęć			Grupa zajęć fakultatywnych Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki		
Forma studiów	stacjonarne	Sposób realizacji			na uczelni		
Rok studiów	4	Język wykładowy			polski		
Semestr studiów	7	Liczba punktów ECTS			3.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki	Forma zaliczenia			egzamin		
Jednostka prowadząca	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Od odpowiedzialny za przedmiot	dr inż. Maciej Wróbel					
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu	dr inż. Maciej Wróbel					
Formy zajęć i metody nauczania	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	30
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów	Udział w konsultacjach		Praca własna studenta		RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	30	3.0		42.0		75
Cel przedmiotu	Dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych optycznych technik pomiarowych wykorzystywanych w przemyśle i w nauce.						
Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy		Efekt z przedmiotu			Sposób weryfikacji i oceny efektu	
	[K6_W31] zna definicje błędu i niepewności pomiaru, metody pomiarowe, a w tym cyfrowe metody pomiarów czasu, częstotliwości i fazy, właściwości przetworników oraz zna systemy przetwarzania sygnałów metodami cyfrowymi		Potrafi zaproponować odpowiednie elementy składowe i konstrukcje spektralnych, interferometrycznych i innych optoelektronicznych układów pomiarowych. Określa źródła szumów i zakłóceń w pomiarach optoelektronicznych.			[SW1] Ocena wiedzy faktograficznej	
	[K6_U06] potrafi analizować działanie elementów, układów i systemów związanych z kierunkiem studiów oraz mierzyć ich parametry i badać charakterystyki techniczne		Analizuje działanie spektrometrów, interferometrów i innych optoelektronicznych układów pomiarowych. Zna ich zastosowania pomiarowe i fizyczne podstawy ich działania.			[SU1] Ocena realizacji zadania	

Treści przedmiotu	<p>1. Podstawowe właściwości światła, oddziaływania światła z materią.Fala elektromagnetyczna, długość fali, zakresy widma optycznegoNatężenie, jednostki fotometryczne i radiometryczne,Polaryzacja, wektor Jones'a, wektor Stokes'a, sfera Poincare'goZałamania i odbicie światła,Dyfrakcja, Pole bliskie i dalekie, Limit dyfrakcyjny, Rzędy dyfrakcji Absorpcja, Absorbancja, prawo Lamberta-Beera</p> <p>2. Rozpraszanie światła i pomiary parametrów rozpraszania. Rozpraszanie światła, podstawy fizyczne, Parametry opisu rozpraszania Mie Pomiary parametrów rozpraszania i absorpcji Sfery integracyjne, budowa, zastosowania ,Sposób pomiaru parametrów radiometrycznych za pomocą sfer, Sposób pomiaru parametrów rozpraszania metodą IAD, Zastosowanie w biomedycynie</p> <p>3. Detekcja synchroniczna w optycznych metodach pomiarowych. Problem szumów w pomiarach optycznych Teoria detekcji synchronicznej (fazoczułej) Układ wzmacniacza typu Lock-in Zastosowania pomiarowe</p> <p>4. Mikroskopia. Podstawy mikroskopii, formowanie obrazu, rozdzielczość, PSF, kontrastMetody poprawy kontrastu, pole jasne, pole ciemne, Mikroskopia polaryzacyjna, kontrast fazowy, Mikroskopia konfokalna</p> <p>5. Spektrometria, Fluorescencja. Podstawy spektralnych metod pomiarowych, Diagram Jabłońskiego, fluorescencja, fosforescencja, spektroskopia absorpcyjna, mikroskopia fluorescencyjna, widma emisyjne i wzbudzenia, spektrofluorymetr, konfokalna laserowa mikroskopia fluorescencyjna, czas życia fluorescencji, zastosowania metod pomiarowych.</p> <p>6. Spektroskopia Ramana i spektroskopia IR. Spektroskopia Ramana, konfigurację układów pomiarowych, podstawy działania. Spektroskopia IR, konfigurację układów pomiarowych, podstawy działania. Mikrospektroskopia Ramana, sondy optyczne, zastosowania metod pomiarowych, analiza danych pomiarowych.</p> <p>7. Interferometria.Interferometry z podziałem amplitudy i frontu falowego, konstrukcje interferometrów,Zaawansowane metody interferometryczne: FTIR, FT-Raman,Interferencja niskokoherencyjna, Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) - w dziedzinie czasu (TD-OCT) i widma (SD-OCT).</p>											
Wymagania wstępne i dodatkowe	Nie ma wymagań											
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	<table border="1" data-bbox="448 1205 1487 1310"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1205 794 1243">Sposób oceniania (składowe)</th> <th data-bbox="794 1205 1141 1243">Próg zaliczeniowy</th> <th data-bbox="1141 1205 1487 1243">Składowa oceny końcowej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1243 794 1276">Laboratorium</td> <td data-bbox="794 1243 1141 1276">50.0%</td> <td data-bbox="1141 1243 1487 1276">60.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1276 794 1310">Egzamin</td> <td data-bbox="794 1276 1141 1310">50.0%</td> <td data-bbox="1141 1276 1487 1310">40.0%</td> </tr> </tbody> </table>			Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej	Laboratorium	50.0%	60.0%	Egzamin	50.0%	40.0%
Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej										
Laboratorium	50.0%	60.0%										
Egzamin	50.0%	40.0%										
Zalecana lista lektur	<table border="1" data-bbox="448 1317 1487 1585"> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1317 794 1518">Podstawowa lista lektur</td> <td colspan="2" data-bbox="794 1317 1487 1518"> <ol style="list-style-type: none"> 1. P.K. Rastogi, Optical Measurement Techniques and Applications, Artech Book House, 1998 2. F Ratajczyk, Dwójłomność i polaryzacja optyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 3. M. Pluta, Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym, WNT Warszawa 1991 4. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, np. 6th Edition, Pergamon Press, Oxford 1993 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1518 794 1552">Uzupełniająca lista lektur</td> <td colspan="2" data-bbox="794 1518 1487 1552">Nie ma wymagan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1552 794 1585">Adresy eZasobów</td> <td colspan="2" data-bbox="794 1552 1487 1585">Adresy na platformie eNauczanie:</td> </tr> </tbody> </table>			Podstawowa lista lektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. P.K. Rastogi, Optical Measurement Techniques and Applications, Artech Book House, 1998 2. F Ratajczyk, Dwójłomność i polaryzacja optyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 3. M. Pluta, Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym, WNT Warszawa 1991 4. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, np. 6th Edition, Pergamon Press, Oxford 1993 		Uzupełniająca lista lektur	Nie ma wymagan		Adresy eZasobów	Adresy na platformie eNauczanie:	
Podstawowa lista lektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. P.K. Rastogi, Optical Measurement Techniques and Applications, Artech Book House, 1998 2. F Ratajczyk, Dwójłomność i polaryzacja optyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 3. M. Pluta, Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym, WNT Warszawa 1991 4. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, np. 6th Edition, Pergamon Press, Oxford 1993 											
Uzupełniająca lista lektur	Nie ma wymagan											
Adresy eZasobów	Adresy na platformie eNauczanie:											

Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opisz zjawisko dyspersji i jego wykorzystanie w spektroskopii. Podstawa fizyczna, wzory, schemat elementów wykorzystujących to zjawisko. 2. Opisz parametry opisujące rozpraszanie i sposób ich pomiaru, schemat układu pomiarowego, algorytmy, zastosowania. Opisz zasadę działania, budowę, sposób pomiaru i zastosowania pomiarowe sfer integracyjnych. 3. Przedstaw sposób opisu stanu polaryzacji, wyjaśnij sposób opisu światła częściowo spolaryzowanego na podstawie sfery Poincare. 4. Opisz zasadę działania metody detekcji synchronicznej, cel jej stosowania, sposób działania i schemat układu, wzory. 5. Przedstaw różne metody uzyskiwania lepszego kontrastu w mikroskopii. Opisz budowę mikroskopu kontrastu fazowego. 6. Opisz zasadę działania mikroskopu konfokalnego. Schemat, ideę i zastosowania, również jako układ w połączeniu z innymi metodami pomiarowych. 7. Opisz, na podstawie diagramów Jabłońskiego, na czym polega zjawisko absorpcji, fluorescencji, fosforescencji i rozpraszania elastycznego światła. 8. Opisz zasadę działania, podstawy fizyczne, układy pomiarowe, oraz podstawowe prawa opisujące metodę spektroskopii absorpcyjnej w UV-VIS. 9. Opisz zasadę działania, podstawy fizyczne, układy pomiarowe, oraz podstawowe prawa opisujące metodę spektroskopii IR, oraz po co stosować ATR. 10. Opisz zasadę działania, podstawy fizyczne, układy pomiarowe, spektroskopii fluorescencyjnej. 11. Jaka jest zależność między widmem absorpcyjnym oraz emisyjnym fluoroforów? Jaka jest różnica pomiędzy widmem wzbudzeniowym a emisyjnym, opisz spektrofluorometr. 12. Opisz zasadę działania, podstawy fizyczne, układ pomiarowy oraz podstawowe prawa opisujące metodę spektroskopii Ramana, zwróć uwagę na praktyczne wykonanie pomiarów, na co należy zwracać uwagę dobierając elementy takiego układu pomiarowego?. 13. Opisz różnicę i podobieństwa między spektroskopią IR a spektroskopią Ramana. 14. Opisz różne sposoby budowy sond w metodzie spektroskopii Ramana i ich zastosowania. 15. Opisz różnicę w sposobie pomiaru widm Ramana (widm IR) w spektrometrze klasycznym (dyspersyjnym) a spektrometrze interferencyjnym (FT-Raman) / (FTIR). 16. Opisz różnicę między interferometrem z podziałem amplitudy a interferometrem z podziałem frontu falowego. 17. Opisz sposób działania optycznej tomografii niskokoherencyjnej OCT (<i>Optical Coherence Tomography</i>), zasada działania, układy pomiarowe, różnice pomiędzy układem z przemiataniem źródła (SS-OCT, <i>Swept Source OCT</i>) a układem w domenie widma (SD-OCT, <i>Spectral-Domain OCT</i>), zastosowania pomiarowe OCT.
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.